

Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej XRF

Metoda przeznaczona do nieniszczącej analizy składu chemicznego obiektów zabytkowych bez konieczności pobierania próbek. Spektrometr XRF może być z łatwością transportowany na miejsce badań co jest szczególnie istotne w przypadku takich obiektów jak np. malarstwo ścienne. Analiza odbywa się w sposób bezkontaktowy i nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla badanego obiektu.



Spektrometr zapewnia natychmiastową analizę składu chemicznego dowolnego materiału, zawierającego pierwiastki o liczbie atomowej większej od 19. Głębokość penetracji wynosi od ok. 30 μm dla metali do kilkuset μm dla warstw malarskich. Duża czułość spektrometru (60 - 300 ppm) gwarantuje detekcję nawet śladowych ilości pierwiastków na badanej powierzchni.

